

日本国特許庁  
JAPAN PATENT OFFICE

16869N-039000

Priority  
Paper  
T-Step file  
5-9-02  
jc872 U.S. PRO  
10/032761  
12/27/01  


別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2001年 5月21日

出願番号

Application Number:

特願2001-150853

出願人

Applicant(s):

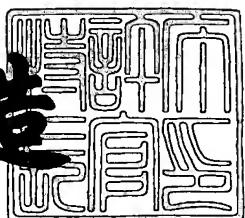
株式会社日立製作所

日立電子エンジニアリング株式会社

2001年 9月17日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2001-3085603

【書類名】 特許願

【整理番号】 NT01P0152

【提出日】 平成13年 5月21日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 G01R 31/28

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立  
製作所 生産技術研究所内

【氏名】 武智 啓三

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立  
製作所 生産技術研究所内

【氏名】 大崎 昭雄

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立  
製作所 生産技術研究所内

【氏名】 林 良彦

【発明者】

【住所又は居所】 東京都渋谷区東3丁目16番3号 日立電子エンジニア  
リング株式会社内

【氏名】 村田 和彦

【特許出願人】

【識別番号】 000005108

【氏名又は名称】 株式会社日立製作所

【特許出願人】

【識別番号】 000233480

【氏名又は名称】 日立電子エンジニアリング株式会社

【代理人】

【識別番号】 100068504

【弁理士】

【氏名又は名称】 小川 勝男

【電話番号】 03-3661-0071

【選任した代理人】

【識別番号】 100086656

【弁理士】

【氏名又は名称】 田中 恭助

【電話番号】 03-3661-0071

【選任した代理人】

【識別番号】 100094352

【弁理士】

【氏名又は名称】 佐々木 孝

【電話番号】 03-3661-0071

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 081423

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 負荷電流 output 回路一体形ドライバ回路及、それを備えたピンエレクトロニクス IC 及び IC テスター

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

被試験デバイスに所定の試験波形を印加するドライバの機能と、前記被試験デバイスからの応答波形を受けて応答波形の状態を判定するために被試験デバイスへの負荷電流を受給し実使用状態を再現する負荷電流 output 機能とを有し、両者の機能を共通回路で構成し、試験波形印可時にはドライバ回路として動作し、応答波形判定時には負荷電流 output 回路として動作することを特徴とする負荷電流 output 回路一体形ドライバ回路。

【請求項 2】

請求項 1 記載の負荷電流 output 回路一体形ドライバ回路において、プッシュプル動作をするバッファ回路と、定電流部と、前記バッファ回路の出力端子及び前記定電流部に接続され、被試験デバイスに対して一方向または逆向の電流を供給することができる一方向導通素子で構成された電流制御部とを供え、前記定電流部の電流を制御してドライバ機能と負荷電流 output 機能を持たせることを特徴とする負荷電流 output 回路一体形ドライバ回路。

【請求項 3】

第 1 の出力端子を供える第 1 のバッファ回路と、第 2 の出力端子を供える第 2 のバッファ回路と、一対の第 3 及び第 4 の出力端子を有し、それぞれ第 1 及び第 2 の出力端子に接続されたダイオードブリッジ回路とを備え、被試験デバイスへ試験波形を出力するときには、ドライバとして第 4 の出力端子から電流を供給し、前記被試験デバイスからの応答波形を受けて応答波形の状態を判定するときには、前記第 2 のバッファ回路をオフして前記第 4 の出力端子から前記被試験デバイスへ負荷電流を供給することを特徴とする負荷電流 output 回路一体形ドライバ回路。

【請求項 4】

請求項 3 記載の負荷電流 output 回路一体形ドライバ回路において、前記第 1 及び

第2のバッファ回路をプッシュプル動作のボルテージフォロワで構成し、前記第1のバッファ回路の最終段トランジスタのオン、オフを制御する第1のスイッチ回路と、第2のバッファ回路の最終段トランジスタのオン、オフを制御する第2のスイッチ回路とを備え、被試験デバイスへ試験波形を出力するときには前記第1及び前記第2のスイッチ回路によって、前記第1及び第2のバッファ回路を動作させて前記第1及び前記第2のバッファ回路の両方の出力から電流を供給し、前記被試験デバイスからの応答波形を受けて応答波形の状態を判定するときには前記第2のスイッチ回路によって前記第2のバッファ回路を非動作状態とし、前記第1のバッファ回路を前記第1のスイッチ回路によって制御して、前記第1のバッファ回路と前記ダイオードブリッジによって被試験デバイスに負荷電流を供給することを特徴とする負荷電流出力回路一体形ドライバ回路。

#### 【請求項5】

請求項1乃至請求項4のいずれかに記載の負荷電流出力回路一体形ドライバ回路を備えることを特徴とするピンエレクトロニクスIC。

#### 【請求項6】

請求項1乃至請求項4のいずれかに記載の負荷電流出力回路一体形ドライバ回路を備えることを特徴とするICテスタ。

#### 【発明の詳細な説明】

##### 【0001】

##### 【発明の属する技術分野】

この発明は、電子デバイスへの負荷電流出力機能を備えるドライバ回路およびICテスタに係り、特に、負荷電流出力回路とドライバ回路の両方の機能を備えながら、回路規模およびチップ面積は両者を合わせた規模および面積より低減でき、さらに、消費電力は両者を合わせた消費電力よりも低減することが可能な負荷電流出力回路一体形ドライバ回路、それを備えたピンエレクトロニクスIC及びICテスタおよびICテスタに関する。

##### 【0002】

##### 【従来の技術】

ICテスタでは、所定の端子に試験波形を印加し、所定の時間後に半導体等の

被試験デバイス（以下DUT）の出力端子（あるいは入出力端子、以下同じ）から出力された応答波形について、HIGHレベル（以下“H”）か、LOWレベル（以下“L”）かを、所定のタイミングで発生するストローブ信号に応じて判定回路で判定し（以下判定モード）、期待値と比較することでDUTの動作試験あるいは性能試験等を行う。この様に応答波形の状態を判定するとき、非終端デバイスに対しては、特定の出力端子に“H”、“L”の出力波形に応じてあらかじめ決められた電流値、例えば、数mAから数十mAの程度の負荷電流を供給して判定が行われる。そのためにICテスタには、判定モード時にDUTの出力端子に負荷電流を供給する負荷電流动出力回路が設けられている。

この負荷電流动出力回路は、通常、内部のダイオードスイッチ回路を介して出力端子に接続状態にされている。この負荷電流动出力回路は、判定モード時にのみ動作するもので、出力端子に接続されたドライバが動作し、電圧を印可している最中に、負荷電流を出力することはない。

#### 【0003】

図9は従来のICテスタのピンエレクトロニクスの回路構成図である。ピンエレクトロニクス2は、被試験デバイス（以下DUT）25の所定の端子に、あらかじめ設定された電圧を印加するためのドライバ20、出力抵抗23、DUT25から出力された応答波形の状態を判定するコンパレータ21、DUT25からの応答波形を得るときに、その端子に所定の負荷電流を供給し、あるいは負荷電流を受ける（または、引出す）負荷電流动出力回路28等とで構成される。DUT25は伝送線路24を介して、ドライバ20とコンパレータ21と負荷電流动出力回路28とに接続されている。このようなピンエレクトロニクス回路がそれぞれデバイスのI/Oピン数×測定デバイス数だけ用意され、複数のDUTに対してそれぞれの応答波形（出力端子からの出力波形）を同時にレベル判定している。

#### 【0004】

図10は従来のドライバの出力バッファ回路である。出力バッファ回路は、トランジスタQ1、Q2で構成される入力段プッシュプル回路と、このプッシュプル回路の位相出力を受けるトランジスタQ3、Q5で構成される第1の出力段バッファアンプ、トランジスタQ4、Q6で構成される第2の出力段バッファアン

プから成る。ドライバの最大出力電流は 60 mA であり、トランジスタ Q5、Q6 には、最大で 60 mA の電流が流れる。

#### 【0005】

図11は従来の負荷電流输出回路の電流バッファ回路である。電流バッファ回路は、ダイオード D1、D2、D3、D4、トランジスタ Q1、Q2 から構成される入力段プッシュプル回路、このプッシュプル回路の位相出力を受けるトランジスタ Q3、Q4 から構成される出力段バッファアンプ、ダイオード D5、D6、D7、D8 のブリッジ回路から構成されるダイオードスイッチ回路から成る。負荷電流の最大出力は 25 mA であり、トランジスタ Q3、Q4 およびダイオード D5、D6、D7、D8 には、最大で 25 mA の電流が流れる。なお、この実施例ではダイオード D5～D8 から構成されるダイオードブリッジ回路はディスクリートで構成されている。

#### 【0006】

このように、従来技術ではドライバの出力バッファ回路と、従来の負荷電流输出回路の電流バッファ回路では、出力段バッファ部に多くの共通点がある。また、この両回路がドライバの動作時と負荷電流输出回路の動作時に重複して動作することはない。

#### 【0007】

##### 【発明が解決しようとする課題】

上記従来技術では、負荷電流输出回路とドライバ回路は、別チップで構成されているか、または、1チップ上にあっても別回路として構成されていた。しかし、このような構成では、近年のDRAMの大容量化や、高スループット化によるテスティングの効率向上へ向けたICテスタの多ピン化により、多数のピンエレクトロニクス回路を使用する関係で、ICテスタが大型化する問題がある。また、多ピン化による消費電力の増加が問題となる。

#### 【0008】

従来技術では、ドライバの出力バッファ回路と、従来の負荷電流输出回路の電流バッファ回路では、出力段バッファ部に多くの共通点があり、また、この両回路がドライバの動作時と負荷電流输出回路の動作時に重複して動作することはな

い。

【0009】

本発明はこの点に着目してなされたものであり、その目的とするところは、電子デバイスへの負荷電流输出回路とドライバ回路とを1チップに集積化する場合に、回路規模およびチップ面積を低減でき、低消費電力化することができる負荷電流输出回路一体形ドライバ回路、それを備えたピンエレクトロニクスIC及びICテスタを提供することにある。

【0010】

【課題を解決するための手段】

このような目的を達成するため、この発明の負荷電流输出回路一体形ドライバ回路、それを備えたピンエレクトロニクスIC及びICテスタは、電子デバイスへの負荷電流输出回路の機能とドライバ回路の機能を備え、前者の電流バッファ回路と後者の出力バッファ回路を共通回路とした共通バッファ回路でドライバ回路を構成するものである。

【0011】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態を、幾つかの実施例を用い、図を参照して説明する。

図1は本発明によるICテスタのピンエレクトロニクスの一実施例を示す回路構成図である。ピンエレクトロニクス200は、DUT25から出力された応答波形の状態を判定するコンパレータ21と、DUT25からの応答波形を得るときに、その端子に所定の負荷電流を供給し、あるいは負荷電流のシンク電流を受ける負荷電流输出回路の機能を備え、DUT25の所定の端子に、あらかじめ設定された電圧を印加するための負荷電流输出回路一体形ドライバ29等とで構成される。DUT25は伝送線路24を介して、負荷電流输出回路一体形ドライバ29とコンパレータ21とが接続されている。端子27にはコンパレータ21での比較結果が出力される。

【0012】

このピンエレクトロニクス200を用いて、DUT25をテストする場合の例

について説明する。DUT25の入力電圧にドライバ29から定電圧を供給し、DUT25の出力端子から電流を引きながら、即ち出力させながら、コンパレータ21により出力端子の電圧を基準電圧と比較することによってDUT25の良否を判定する。書き込み機能を持つDUT25については、第1のテストで、DUT25の入力端子にドライバ29から定電圧を供給して書き込みを行う。第2のテストで、DUT25の所定の端子にドライバ29から定電圧を供給し、読み出し命令を実行し、DUT25の出力端子から電流を引きながら、出力端子の電圧を基準の電圧と比較し、DUT25の良否を判定する。このように、DUT25から所定の電流を引き出すのは、このDUT25に接続される負荷回路を擬似的に作るためである。

### 【0013】

次に、図1に示したピンエレクトロニクスの具体的な回路について、図2を用いて説明する。

図2は本発明による負荷電流出力回路一体形ドライバ回路の一実施例を示す回路図である。図に示す負荷電流出力回路一体形ドライバ回路は、トランジスタQ1、Q2で構成される入力段プッシュプル回路と、このプッシュプル回路の位相出力を受けるトランジスタQ3、Q5で構成される第1の負荷電流出力回路用出力段バッファアンプと、トランジスタQ4、Q6で構成される第2の負荷電流出力回路用出力段バッファアンプと、入力段プッシュプル回路の位相出力を受けるトランジスタQ3、Q7で構成される第1のドライバ回路用出力段バッファアンプと、トランジスタQ4、Q8で構成される第2のドライバ回路用出力段バッファアンプと、ダイオードD1、D2、D3、D4をブリッジ接続したダイオードスイッチ回路とを備えている。入力段プッシュプル回路のトランジスタQ1、Q2のエミッタ側にそれぞれ設けられたスイッチS1、S2は、それぞれバイアス電流を遮断する回路である。負荷電流出力回路用出力段バッファアンプのトランジスタQ5、Q6のベースと電源ラインVcc、Veeとの間にそれぞれ設けられたスイッチS3、S4は、それぞれの出力段トランジスタQ5、Q6をカットオフさせる回路である。また、ドライバ回路用出力段バッファアンプのトランジスタQ7、Q8のベースと電源ラインVcc、Veeとの間にそれぞれ設けられ

たスイッチ S 5、S 6 は、それぞれの出力段トランジスタ Q 7、Q 8 をカットオフさせる回路である。これらのスイッチ S 1～S 6 路は、制御信号によりオン／オフされて、負荷電流回路およびドライバ回路の入力と出力を切断する。なお、本実施例において、トランジスタ Q 3 と Q 3、トランジスタ Q 4 と Q 6 はダーリントン接続されている。

## 【0014】

本構成において、スイッチ S 1 及び S 2 はこのピンエレクトロニクスを備える IC テスターを用いて DUT を試験する場合にオンにし、試験をしない場合には、電流の漏洩を防止するために、オフにしておく。

## 【0015】

ここで、スイッチ S 3 をオンにすると、負荷電流回路用トランジスタ Q 5 は、カットオフ状態になり、前段のトランジスタ Q 3 との接続が切断される。また、スイッチ S 3 をオフにすると、バイアス抵抗 R 1 からベース電流が供給されてトランジスタ Q 5 はオンになる。

スイッチ S 4 をオンにすると、負荷電流回路用トランジスタ Q 6 は、カットオフ状態になり、前段のトランジスタ Q 4 との接続が切断される。また、スイッチ S 4 をオフにすると、バイアス抵抗 R 2 からベース電流が供給されてトランジスタ Q 6 はオンになる。なお、抵抗 R 3 はトランジスタ Q 6 のベースと電源 V<sub>ee</sub> 間に接続されている。バイアス抵抗である。

同様に、スイッチ S 5、S 6 をオンにすると、ドライバ回路用トランジスタ Q 7、Q 8 は、カットオフ状態になり、前段のトランジスタ Q 3、Q 4 との接続が切断される。一方、これらのスイッチがオフになれば、それぞれ、トランジスタ Q 7、Q 8 にバイアス抵抗 R 4、R 5 からベース電流が供給されるため、トランジスタ Q 7、Q 8 はオンになり、この回路は、バッファ動作を行う。なお、抵抗 R 6 はトランジスタ Q 8 と電源 V<sub>ee</sub> 間に接続されているバイアス抵抗である。

## 【0016】

図 2 の回路をドライバ回路用出力段バッファとして使用する場合には、スイッチ S 3 及び S 5、またはスイッチ S 4 及び S 6 がオフされる。即ち、出力端子 OUT に “H” を発生する場合には、入力端子 IN に “H” の電圧が供給される。

この場合、スイッチS3及びS5をオフ、スイッチS4、S6をオンにして、トランジスタQ3、Q5及びQ7をオンにし、トランジスタQ4、Q6及びQ8をオフにする。逆に、出力端子OUTに電圧“L”を発生させる場合には、入力端子INに電圧“L”を供給し、スイッチS3及びS5をオンにし、スイッチS4、S6をオフにして、トランジスタQ3、Q5及びQ7をオフにし、トランジスタQ4、Q6及びQ8をオンにする。

トランジスタQ3、Q5、Q7をオンにすると、電源VccからトランジスタQ7を通してDUTに電流が流れ、定電流部23からダイオードD3を通してDUTに電流が流れ、更に電源VccからトランジスタQ5、ダイオードD2を通して定電流部24に電流が流れ、出力端子OUTの電圧は“L”になる。なお、出力端子OUTから出力する電圧値に応じて定電流部の電流値を変えてもよい。このようにして、出力端子OUTは定電圧に保たれる。

トランジスタQ4、Q6、Q8をオンにすると、DUTからトランジスタQ8を通して電源Veeに電流が流れ、DUTからダイオードD4を通して定電流部24に電流が流れ、更に定電流23からダイオードD1、トランジスタQ6を通して電源Veeに電流が流れ、出力端子OUTは“L”になる。なお、出力端子OUTから出力する電圧値に応じて定電流部の電流値を変えてもよい。このようにして、出力端子OUTは定電圧に保たれる。

#### 【0017】

負荷電流回路として使用する場合には、スイッチQ5、Q6をオンして、トランジスタQ7、Q8をオフさせる。また、DUTに電流を供給する場合には、トランジスタQ3、Q5をオンさせ、トランジスタQ4、Q6をオフさせる。逆に、DUTからこの負荷電流回路に電流を流入させる場合には、トランジスタQ3、Q5をオフさせ、トランジスタQ4、Q6をオンさせる。

出力端子OUT、すなわち、DUTの端子電圧が、負荷電流回路一体形ドライバ回路の入力端子INの設定電圧より低いときには、言い換えれば、DUTが、“L”の出力信号を発生したときには、ダイオードスイッチ回路の第1の端子1が第2の端子2よりも高いので、ダイオードD1とD4がオフになり、ダイオードD2とD3がオンになる。その結果、出力バッファアンプのトランジスタ

Q5の出力電流がダイオードD2を介して、外部からの制御信号により所望の電流値に制御される定電流部24へと流れる。さらに、所望の電流値に制御される定電流部23からの電流がダイオードD3を介し、出力端子OUTを経由してDUTへと流れ、負荷電流を出力する働きをする。

## 【0018】

負荷電流输出回路一体形ドライバ回路の出力端子OUT、すなわち、DUTの端子電圧が、負荷電流输出回路一体形ドライバ回路の第1の端子Iの設定電圧より高いときには、言い換えれば、DUTが、“H”の出力信号を発生したときには、ダイオードスイッチ回路の第1の端子1が第2の端子2よりも低くなるので、ダイオードD1とD4がオンになり、ダイオードD2とD3がオフになる。その結果、前記定電流部23の電流は、ダイオードD1を通して出力バッファアンプQ6へと流れる。さらに、DUTから電流が出力端子OUTを経由し、ダイオードD4を介して前記定電流部24へと流れ、負荷電流を引き込む働きをする。

## 【0019】

この回路を評価するため、S P I C Eシミュレーションを行った。その結果を、図3を用いて説明する。

図3は本発明を適用した負荷電流一体形ドライバ回路のドライバ出力波形と負荷電流输出回路のオン／オフ波形を示す図であり、図3(a)は負荷電流输出回路のオン／オフ波形図、図3(b)はドライバ波形図である。図4は従来のドライバ回路のドライバ出力波形と負荷電流输出回路のオン／オフ波形を示す図であり、図4(a)は負荷電流输出回路のオン／オフ波形図、図4(b)はドライバ波形図である。いずれの波形図においても、横軸に時間(n s)を示し、縦軸に電圧(V)を示す。

負荷電流输出回路は、主に、負荷電流输出のオン／オフ切替時間と任意に設定した電流値を正しく出力する出力電流精度とで評価を行う。図3(a)および図4(b)において、オン／オフ波形は、設定電流を±25mA、±16mA、±10mAに設定して出力の波形を重ね書きしたものである。図3(a)において、31a、31bはそれぞれ設定電流が+25mA、-25mAの場合の電圧特性曲線を、32a、32bはそれぞれ設定電流が+16mA、-16mAの場合

の電圧特性曲線を、33a、33bはそれぞれ設定電流が+10mA、-10mAの場合の電圧特性曲線を示す。同様に、図4(a)において、41a、41bはそれぞれ設定電流が+25mA、-25mAの場合の電圧特性曲線を、42a、42bはそれぞれ設定電流が+16mA、-16mAの場合の電圧特性曲線を、43a、43bはそれぞれ設定電流が+10mA、-10mAの場合の電圧特性曲線を示す。

図3(a)と図4(a)から明らかなように、負荷電流出力回路に関しては従来と同等の性能を得ることができる。

#### 【0020】

ドライバ波形は、設定振幅を0.8V、-1.2V、-1.6Vに設定して、出力の波形を重ね書きしたものである。図3(a)において、34は設定振幅を0.8Vの場合の電圧特性曲線を、35は設定振幅を1.2Vの場合の電圧特性曲線を、36は設定振幅を1.6Vの場合の電圧特性曲線を示す。同様に、図4(b)において、44は設定振幅を0.8Vの場合の電圧特性曲線を、45は設定振幅を1.2Vの場合の電圧特性曲線を、46は設定振幅を1.6Vの場合の電圧特性曲線を示す。

図3のドライバの特性曲線34～36において、波形が立ち上がる時のオーバーシュートは、伝送線路の損失により波形が欠けるのを防止するために設けたオーバーシュート発生回路によるものである。また、波形の立ち上がり時間は、高速化する被試験デバイスに向けて、約2倍に高速化している。ドライバ回路に関してもLSIテストに適用可能な性能を得ることができる。

#### 【0021】

図5は負荷電流一体形ドライバ回路と従来のドライバ回路及び負荷電流出力回路のシミュレーション結果をまとめたテーブルである。消費電力は、従来のドライバ回路と負荷電流出力回路の消費電力の合計が7.1Wであるのに対し、負荷電流一体形ドライバ回路では4.5Wである。さらに、チップ面積では、従来のドライバ回路が $3.7 \times 3.7 \text{ mm}^2$ 、負荷電流出力回路が $3.0 \times 3.0 \text{ mm}^2$ であり、面積の総計が $22.69 \text{ mm}^2$ となるのに対し、負荷電流一体形ドライバ回路では $4.0 \times 4.0 \text{ mm}^2$ である。また、実装面積も従来のドライバ回路と

負荷電流出力回路の合計が $690\text{ mm}^2$ となるのに対して、本実施例の負荷電流一体形ドライバ回路では $460\text{ mm}^2$ となり、大きく異なる。

この様に、回路の性能は従来と同等で、消費電力およびチップ面積を低減できる。チップ面積の低減は、小形パッケージへの搭載が可能となり、実装面積の低減にもつながる。

#### 【0022】

図2の実施例において、ドライバ出力時の出力電流供給方法は、スイッチS3、S4、S5、S6をオフにして、ドライバ出力電流をトランジスタQ7、Q8と、ダイオードD1、D2、D3、D4の両方から供給しても良いし、スイッチS5、S6をオフにしてQ7、Q8からのみ出力電流を供給しても良い。大きなドライバ出力電流を得るためにには、後者的方式では、トランジスタQ7、Q8のトランジスタサイズが大きくなることから、出力電流を分けて供給できる前者の方式が有利であるが、いずれの実施例をも利用することができる。

#### 【0023】

図6は本発明による負荷電流出力回路一体形ドライバ回路の他の実施例を示す回路図である。この実施例では、負荷電流出力回路とドライバ回路の出力段バッファアンプを共通のトランジスタQ5、Q6で構成している。また、スイッチS3、S4をオフすることによって、トランジスタQ5、Q6はオンとなることは図2の実施例の場合と同様であり、第1の端子1の電圧が第2の端子2より低い場合にはダイオードD1、D4がオンになり、第1の端子1の電圧が第2の端子2の電圧より高い場合には、ダイオードD2、D3がオンすることも図2の実施例と同様である。

本実施例では、負荷電流出力回路として動作する場合も、ドライバ回路として動作する場合にもトランジスタQ3～Q6、ダイオードD1～D4の動作は同じである。出力端子OUTを“L”に設定する場合には、スイッチS3をオフにし、スイッチS4をオンにすることによって、トランジスタQ3、Q5をオンにし、トランジスタQ4、Q6をオフにする。この場合、ダイオードD2、D3がはオンになり、電源VccからトランジスタQ5、ダイオードD2を通して電流がながれ、更に、定電流部23から出力端子OUTを通してDUTに電流が流れる

。出力端子OUTを“H”に設定する場合には、スイッチS3をオンにし、スイッチS4をオフにすることによって、トランジスタQ4、Q6をオンにし、トランジスタQ3、Q5をオフにする。この場合、ダイオードD1、D4がはオンになり、定電流部23からダイオードD1、トランジスタQ6を通って電源Veeに電流が流れ、更に、DUTからダイオードD4を通って定電流部24に電流が流れる。この実施例では、ドライバ回路として使用する場合には、定電流部23、24の電流値を、例えば0～65mAの間で変化させて出力端子OUTに必要な電圧を発生させるようにし、負荷電流输出回路として使用する場合には、定電流部23、24を例えば0～±25mAの間で変化させて、必要な電流をDUTに流出し、または、DUTからこの一体形ドライバ回路に電流を流入する。

## 【0024】

図7は図2と図6の回路方式における最終段出力バッファ回路のみのシミュレーション結果を示すテーブルである。図に示すように、図6の回路方式の場合、図2の回路方式より部品点数が減る。しかし、図2の回路方式のダイオードブリッジに流す電流は、負荷電流输出の最大電流であり、消費電力は700mWであるのに対し、図6の回路方式では、それよりも大きいドライバの最大電流をダイオードに流す必要があるため、消費電力は1500mWとなるため、ダイオードサイズが大きくなり、チップ面積、即ち部品の占有面積はほとんど同じになる。さらに、サイズの大きいダイオードを用いるため、図2の実施例では立ち上がり時間が200psであるのに対して、図6の実施例では、ドライバ出力波形の立ち上がり時間が300psと遅くなる。また、消費電力は、ドライバ動作時にもダイオードに電流を流すため図2の回路方式より大きくなり、最終段出力バッファ回路のみで比較すると約2倍の消費電力が必要となる。

## 【0025】

図8は本発明による負荷電流输出回路一体形ドライバ回路を備えたICテスタの一部構成を示すブロック図である。図8において、ICテスタは制御コンピュータ11、モニタ12、プリンタ13、基準信号発生器14、タイミング発生器15、パターン発生器16、比較した結果を記憶するフェイルメモリ17、デジタルコンパレータ18、波形フォーマッタ19、負荷電流输出回路一体形ドライ

バ29、アナログコンパレータ21、リファレンス電圧発生器22、により構成される。基準信号発生器14は、試験波形の時間基準となる基準クロック14aを発生する。タイミング発生器15は基準クロック14aを、テスタバス26を介して設定されるタイミング設定信号26bにしたがい基準クロック14aを計数し、所望の周期、時間遅れをもつフェーズ信号15a、15b、15cを生成する。パターン発生器16はタイミング発生器15からの、フェーズ信号15bのタイミングでパターンデータ信号16aを発生する。波形フォーマッタ19はタイミング信号15aのタイミングでパターンデータ信号16aを論理合成して被試験デバイスを試験するためのテスト波形19aを生成する。負荷電流回路一体形ドライバ29はテスト波形19aをリファレンス電圧発生器22から入力される波形設定レベル信号22aにしたがったハイレベル、ローレベルのテスト波形29aに波形整形し、伝送線路24を介して、DUT25に印加する。アナログコンパレータ21はDUT25の応答波形25aを、伝送線路24を介して入力し、フェーズ信号15cのタイミングで、リファレンス電圧発生器22で発生した比較電圧22aと比較し、比較結果21aを出力する。このとき、負荷電流回路一体形ドライバ29は、DUT25の出力端子に所定の負荷電流を供給、あるいは負荷電流としてシンク電流を受ける負荷電流回路となる。また、デジタルコンパレータ18はアナログコンパレータ21で比較したDUT25の応答波形21aと良品の応答である期待値信号16bをフェーズ信号15cのタイミングで比較し、良否判定を行う。フェイルメモリ17はDUT25の良否判定した判定結果18aを格納し、試験終了後にテスタバス26を介して判定結果26dを制御コンピュータ1に出力する。上記の動作をDUT25の各ピン毎同時にを行い、DUT25の良否判定が完了する。

## 【0026】

上記構成において、本発明における負荷電流回路一体形ドライバ回路を備えたピンエレクトロニクスを適用することによって、低消費電力で小形かつ低価格なI.Cテスタを実現できる。

## 【0027】

以上説明してきたが、実施例のダイオードブリッジは、トランジスタにより形

成されるダイオードであってもよい。また、実施例の出力段バッファアンプは、P N PトランジスタとN P Nトランジスタで構成されるインバーテッドダーリントンに限定されない。

#### 【0028】

以上述べたように、本発明による、負荷電流出力回路一体形ドライバ回路は、被試験デバイスに所定の試験波形を印加するドライバの機能と、前記被試験デバイスからの応答波形を受けて応答波形の状態を判定するために被試験デバイスへの負荷電流を受給し実使用状態を再現する負荷電流出力機能とを有し、両者の機能を共通回路で構成し、試験波形印可時にはドライバ回路として動作し、応答波形判定時には負荷電流出力回路として動作する。

#### 【0029】

この負荷電流出力回路一体形ドライバ回路では、プッシュプル動作をするバッファ回路と、定電流部と、前記バッファ回路の出力端子及び前記定電流部に接続され、被試験デバイスに対して一方向またはそれとは逆の方向の電流を供給することができる一方向導通素子で構成された電流制御部とを供え、前記定電流部の電流を制御してドライバ機能と負荷電流出力機能を持たせる。この電流制御部は例えば、ダイオードブリッジ回路で構成され、一対の端子の一方がバッファ回路に接続され、他方が被試験デバイスと接続される出力端子として構成され、他の一対の端子に定電流部が接続される。

#### 【0030】

このように、本発明では、電子デバイスへの負荷電流出力回路の機能とドライバ回路の機能を備え、前者の電流バッファ回路と後者の出力バッファ回路を共通回路とすることで、電子デバイスへの負荷電流出力回路とドライバ回路の両方の機能を備えながら、回路規模およびチップ面積は両者を合わせた規模および面積より低減することができる。その結果、ドライバと負荷電流出力回路を含むピンエレクトロニクス回路の実装面積を低減することができる。消費電力は両者を合わせた消費電力よりも低減することができ、発熱量を低減することができる。

#### 【0031】

さらに、小形かつ低価格なピンエレクトロニクス回路となり、多数のピンエレ

クトロニクス回路を使用するICテスターの小形化、低消費電力化が実現でき、低消費電力化による発熱量の低減ができる。

【0032】

【発明の効果】

以上述べたように、この発明によれば、電子デバイスへの負荷電流出力回路とドライバ回路の両方の機能を備えながら、回路規模およびチップ面積は両者を合わせた規模および面積より低減でき、消費電力は両者を合わせた消費電力よりも低減することができる。その結果、実装面積を低減することができ、発熱量を低減することができる。

【0033】

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明によるICテスターのピンエレクトロニクスの一実施例を示す回路構成図である。

【図2】

本発明による負荷電流出力回路一体形ドライバ回路の一実施例を示す回路図である。

【図3】

本発明を適用した負荷電流一体形ドライバ回路のドライバ出力波形と負荷電流出力回路のオン／オフ波形を示す図である。

【図4】

従来のドライバ回路のドライバ出力波形と負荷電流出力回路のオン／オフ波形を示す図である。

【図5】

負荷電流一体形ドライバ回路と従来のドライバ回路及び負荷電流出力回路のシミュレーション結果をまとめテーブルである。

【図6】

本発明による負荷電流出力回路一体形ドライバ回路の他の実施例を示す回路図である。

【図7】

図2と図6の回路方式における最終段出力バッファ回路のみのシミュレーション結果を示すテーブルである。

【図8】

本発明による負荷電流出力回路一体形ドライバ回路を備えたICテスタの一部構成を示すブロック図である。

【図9】

従来のICテスタのピンエレクトロニクスの回路構成図である。

【図10】

従来のドライバの出力バッファ回路である。

【図11】

従来の負荷電流出力回路の電流バッファ回路である。

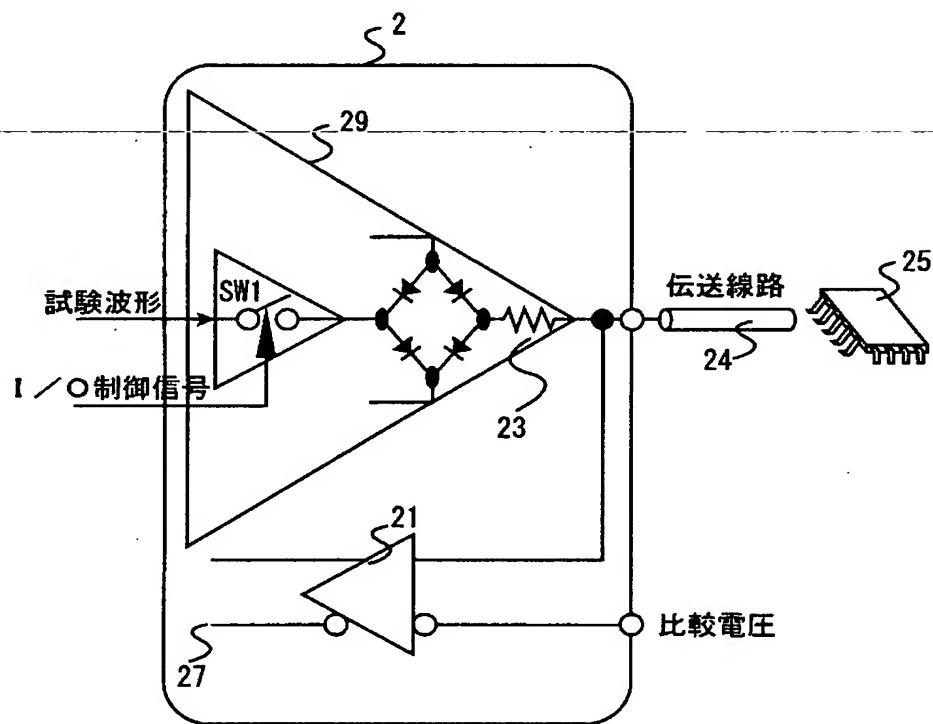
【符号の説明】

2…ピンエレクトロニクス、11…コンピュータ、12…モニタ、13…プリンタ、14…基準信号発生器、15…タイミング発生器、16…パターン発生器、17…フェイルメモリ、18…デジタルコンパレータ、19…波形フォーマタ、20…ドライバ、21…アナログコンパレータ、22…リファレンス電圧発生器、24…伝送線路、25…被試験デバイス、29…負荷電流出力回路一体形ドライバ。

【書類名】 図面

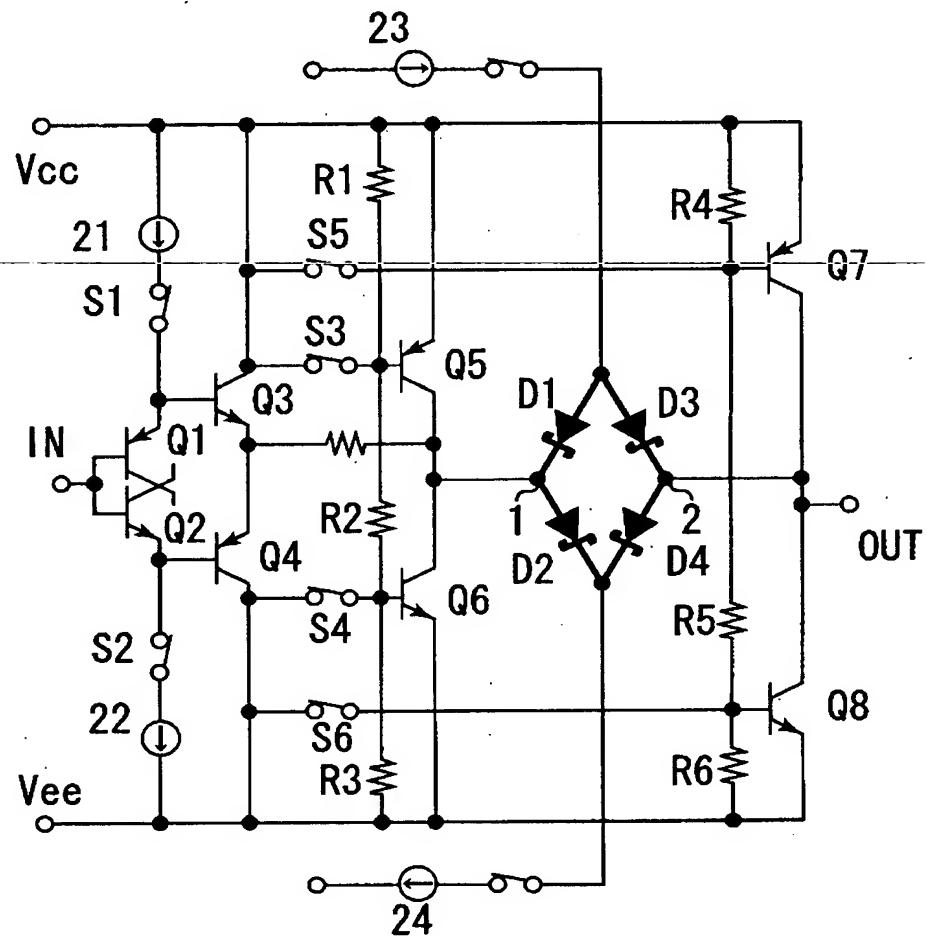
### 【図1】

1



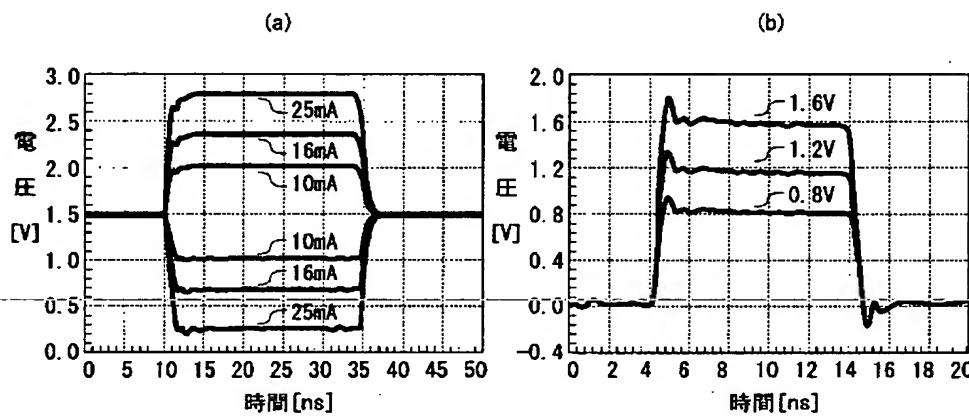
【図2】

図2



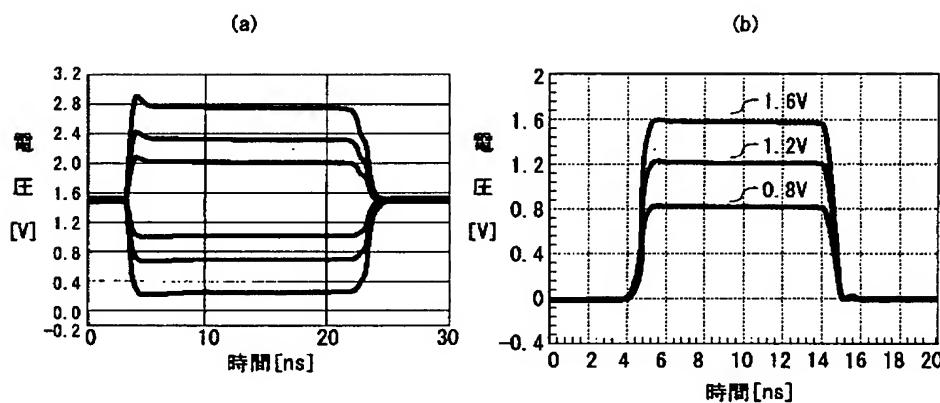
【図3】

図3



【図4】

図4



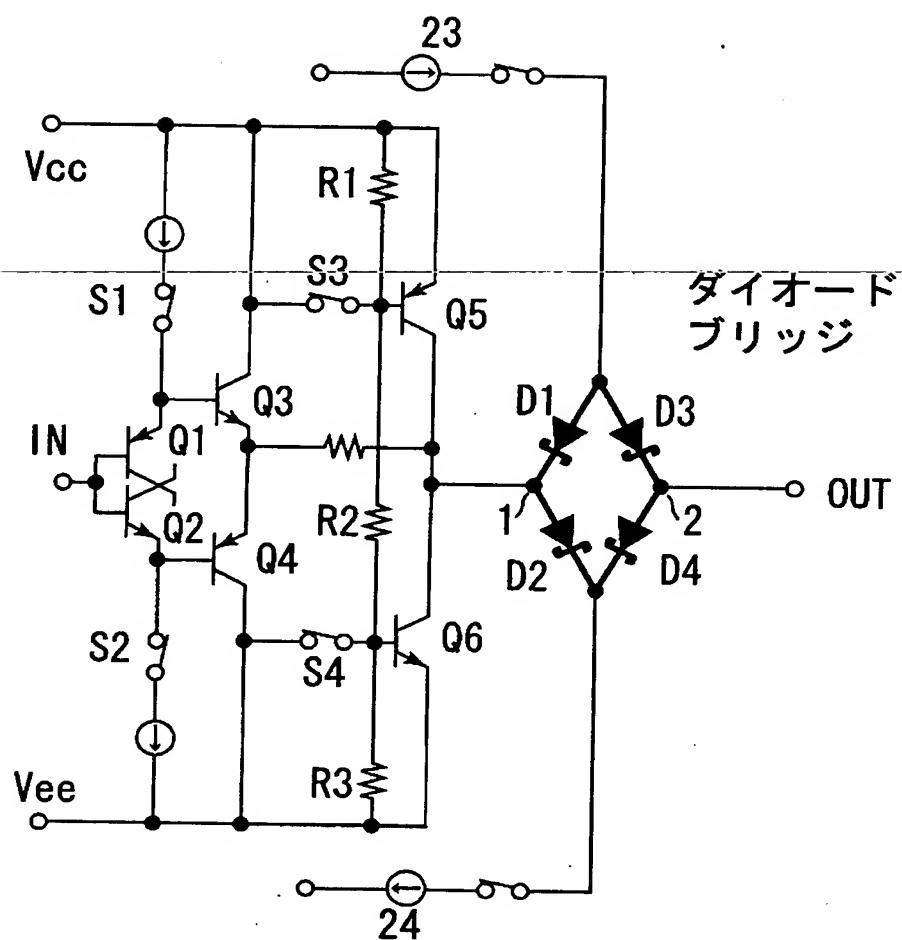
【図5】

## 図5

項目	一体型ドライバ	従来	
		ドライバ	ダイナミック ロード
消費電力	4.5W	3.6W 7.1W	3.5W
チップ面積 [mm <sup>2</sup> ]	4.0×4.0 =16.0	3.7×3.7 =22.69	3.0×3.0
実装面積 [mm <sup>2</sup> ]	460	690	

【図6】

図6



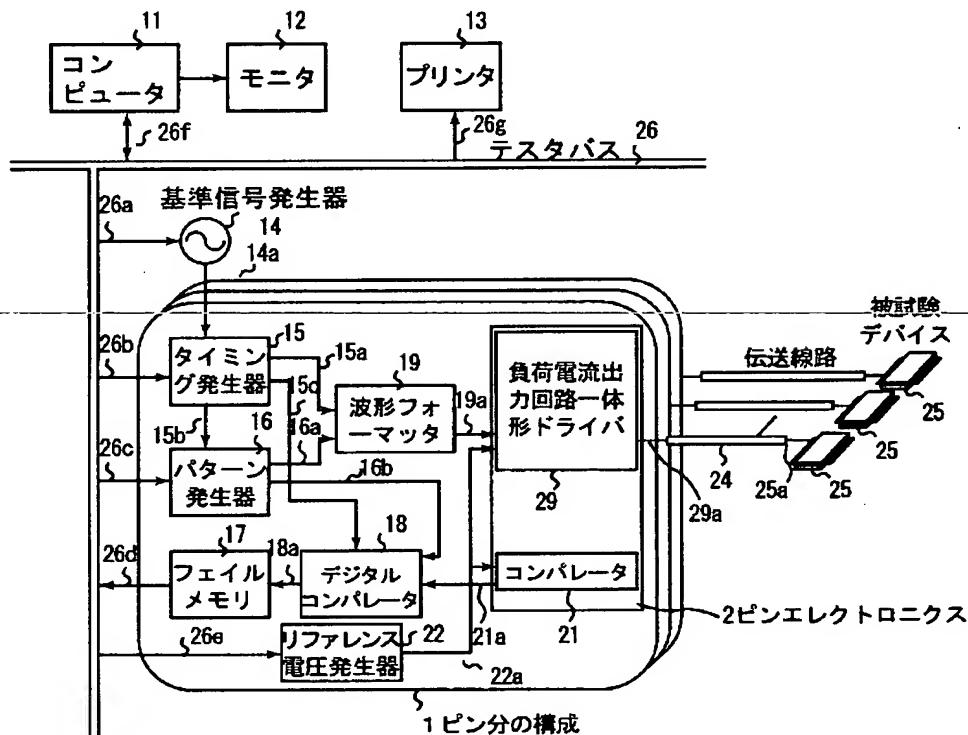
【図7】

図7

項目	図2の回路方式	図3の回路方式
消費電力	700mW	1500mW
チップ面積[mm <sup>2</sup> ]	0.7(従来1.0)	0.7(従来1.0)
立ち上り時間(1.6V)	200ps	300ps

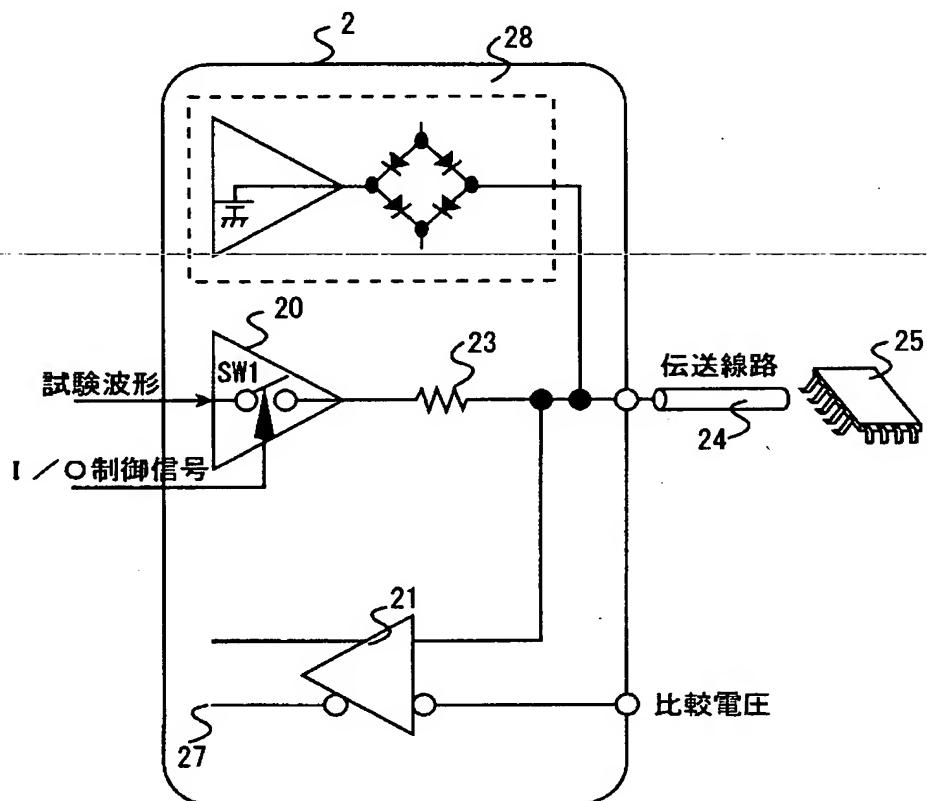
【図8】

四 8



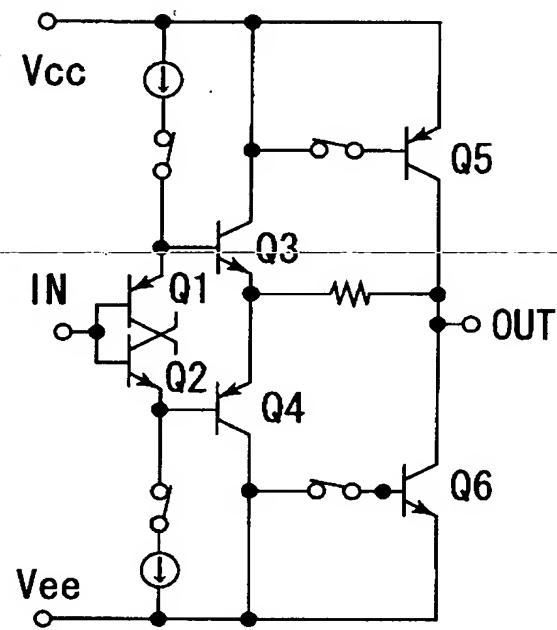
【図9】

図9



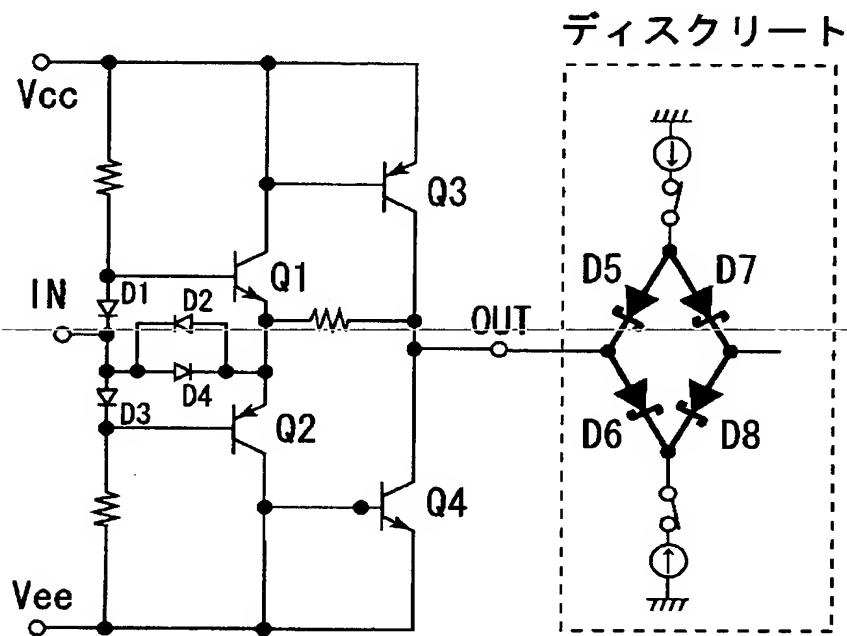
【図10】

図10



【図11】

図11



【書類名】要約書

【要約】

【課題】 電子デバイスへの負荷電流输出回路とドライバ回路とが1つのICに集積化され、回路規模およびチップ面積を低減でき、低消費電力化することができる負荷電流输出回路一体形ドライバ回路およびICテスタを提供することにある。

【解決手段】 電子デバイスへの負荷電流输出回路の機能とドライバ回路の機能を備え、両者を共通回路で構成する。

【選択図】 図1

出願人履歴情報

識別番号 [000005108]

1. 変更年月日 1990年 8月31日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

氏 名 株式会社日立製作所

出願人履歴情報

識別番号 [000233480]

1. 変更年月日 1994年 9月20日

[変更理由] 住所変更

住 所 東京都渋谷区東3丁目16番3号

氏 名 日立電子エンジニアリング株式会社